

ナノプローブテクノロジー167委員会 第67回研究会

テーマ：標準化・SPM理論と電気計測最前線

ナノプローブ技術の継続的な発展のために、その技術の標準化や理論によるサポートは欠かせないものです。また、電気計測は技術の応用例として常に注目されます。そこで、その将来像を見据え、「標準化・SPM理論および電気計測の最前線」ということで今回の研究会を企画しました。

日時：平成24年7月17日(火) 13:30-17:20、18日(水) 8:40-12:20

場所：物質材料研究機構（NIMS）千現地区第一会議室

プログラム

7月17日(火)

13:30-13:40 事務連絡

[標準化]

13:40-14:20 「走査型プローブ顕微鏡法の国際標準化とロードマップ（仮）」

藤田大介（NIMS 先端的共通技術部門）

14:20-15:00 「トレーサブル測長 AFM による計量標準と標準化への取り組み（仮）」

権太 聡（産総研 計測標準研究部門）

15:00-15:20 休憩

15:20-16:00 「AFM プローブ特性と関連する国際標準の動向（仮）」

井藤浩志（産総研 計測フロンティア研究部門）

[ナノプローブテクノロジー奨励賞受賞講演]

16:00-16:40 「走査プローブ顕微鏡による C₆₀ 分子間結合の

ナノスケール制御とその素子応用（仮）」

中谷真人（JST 中嶋ナノクラスター集積制御プロジェクト）

[理論]

16:40-17:20 「炭素・シリコン界面の超潤滑・接着

～ グリーントライボロジーに向けて（仮）」

佐々木成朗（成蹊大学 理工学部）

17:30- 懇親会

会場：NIMS 千現地区食堂

会費：3,000～3,500 円

7月18日(水)

[理論]

8:40- 9:20

「液中 AFM および接触過程の理論シミュレーション (仮)」

塚田 捷 (東北大学 原子分子材料科学高等研究機構)

[電気計測]

9:20-10:00

「多探針測定技術による半導体・ナノワイヤの電気計測とロードマップ」

長谷川修司 (東京大学 大学院理学系研究科)

10:00-10:20

休憩

10:20-11:00

「走査型プローブ顕微鏡を用いた

CNT トランジスタの電気伝導特性測定」

水谷 孝 (名古屋大学 大学院工学研究科)

11:00-11:40

「AFM を用いた超格子相変化膜の電気特性」

小高貴浩 (産総研 連携研究体グリーン・ナノエレクトロニクスセンター)

11:40-12:20

「走査型マイクロ波顕微鏡・ケルビンフォース顕微鏡による

局所電気特性測定」

相蘇 亨 (東陽テクニカ)

企画委員

産総研GNC 白田宏治

NIMS 藤田大介

NIMS 久保 理

東北大学 中嶋 健